

Metallische Überzüge
Messung der Schichtdicke
Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop
(ISO 9220 : 1988)
Deutsche Fassung EN ISO 9220 : 1994

DIN
EN ISO 9220

ICS 25.220.40

Deskriptoren: Metallüberzug, Schichtdickenmessung, Rasterelektronenmikroskop, mikroskopische Untersuchung

Metallic coatings —

Measurement of coating thickness; Scanning electron microscope method
(ISO 9220 : 1988);

German version EN ISO 9220 : 1994

Revêtements métalliques —

Mesurage de l'épaisseur de revêtement; Méthode au microscope électronique à balayage
(ISO 9220 : 1988);

Version allemande EN ISO 9220 : 1994

Die Europäische Norm EN ISO 9220 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Das Komitee CEN/TC 262 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe" (Sekretariat Deutschland) hat diese Europäische Norm nach positivem Ergebnis des PQ-Verfahrens (Erstfragebogenverfahren) vom ISO/TC 107 "Metallische und andere anorganische Überzüge" vollständig übernommen.

Für die deutsche Übersetzung ist der Arbeitsausschuß NMP 161 "Überzüge und Korrosion" des Normenausschusses Materialprüfung verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1463 siehe DIN EN ISO 1463

ISO 2064 siehe DIN EN ISO 2064

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN EN ISO 1463 Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopische Methode (ISO 1463 : 1982); Deutsche Fassung EN ISO 1463 : 1994

DIN EN ISO 2064 Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die Messung der Schichtdicke betreffen (ISO 2064 : 1980); Deutsche Fassung EN ISO 2064 : 1994

Internationale Patentklassifikation

G 01 B 007/06

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ICS 25.220.40

Deskriptoren: Überzug, Metallüberzug, Test, Bestimmung, Dicke, Dickenmessung

Deutsche Fassung

**Metallische Überzüge
Messung der Schichtdicke
Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop
(ISO 9220 : 1988)**

Metallic coatings — Measurement of coating thickness; Scanning electron microscope method; (ISO 9220 : 1988)

Revêtements métalliques — Mesurage de l'épaisseur de revêtement; Méthode au microscope électronique à balayage; (ISO 9220 : 1988)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1994-10-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel